

Journée Thématique du réseau R&D semi-conducteurs - Effets des irradiations dans les détecteurs semi-conducteurs

ID de Contribution: **0**

Type: **Non spécifié**

Capteurs HVCMOS pour SLHC

jeudi 16 juin 2016 11:00 (30 minutes)

Orateur: BARBERO, Marlon (CPPM)